



## 2020年CSNS反角白光中子源用户研讨会（第四届）

Monday, 10 August 2020

第五组：中子测量和成像【包括能谱测量、裂变中子谱、积分实验】 - 会议 ID: 295 513 035 (15:45 - 18:00)

-Conveners: 孙 伟力

time	[id]	title	presenter
15:45	[43]	Back-n实验厅1小束斑能谱测量	永浩, 陈
16:05	[44]	Back-n中子束线测试的探测器研制	杰, 鲍
16:25	[45]	Back-n上射线成像实验研究	小松, 严
16:45	[46]	基于白光中子源的准积分实验测量研究	琰琰, 丁 阳波, 聂
17:00	[47]	高能中子屏蔽基准实验设想	通华, 朱 鑫鑫, 鹿
17:15	[48]	合作讨论	
17:45	[49]	总结	伟力, 孙